erch N	otes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent u	nder
10/631,799	KELLEY, BRIAN TO	DDD
Examiner	Art Unit	
Duc M. Nauven	2685	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
455	501->506 63.1 65 67.11		
	67.16 130		
	132->139		
	269->273		
	275-278.1		
	296 306		
375	142->144		
	147->152		
	343 349		
	350		
370	335		
	342	1/24/2006	DN
yeda	ed	7/17/06	pu
4		· · ·	

INTERFERENCE SEARCHED		
Subclass	Date	Examiner
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<u> </u>	
	<del>                                     </del>	1

(INCLUDING SEA	RCH STRATEGY	<u>)</u>
	DATE	EXMR
EAST, IEEE	1/24/2006	DN
·····		